



画像解析装置 & 金相試料調整装置および調整材料

画像解析装置

米国LECO社の2001型は、操作性、高速処理、大容量を特に重視し研究・開発、品質管理用の画像解析装置として開発されました。米国をはじめ、世界17ヶ国のI.A.分野のユーザーより高い評価をいただいております。

計測の一例：

- 非金属介在物の自動計測
ASTM, DIN, JIS
- 平均粒径計測
ASTM #112

オートステージおよびオートフォーカスを組み込むことにより顕微鏡観察の応用範囲は更に広がります。



LECO2001型

金相試料調整装置&調整材料

● ダイヤモンドスプレー研磨剤

● 自動研磨機

ヘッドを測面でロックしておけば、手動による研磨作業も容易に行なえます。



AP-300型



- インポートタイプですので塗布しやすく、ムダがありません。
- フロンガスは含まれていません。
- 粒度は45,30,15,9,6,3,1および0.25μmの8種類です。



金相試料調整装置および調整材料、多数揃えております。カタログ価格表をご希望の方は弊社営業部へお申し付け下さい。



日本総代理店 **日本アナリスト株式会社**

定評ある
品質とサービス

本 社 〒141 東京都品川区西五反田 3-8-8 (町原ビル) ☎(03)3493-7281代
大 阪 支 店 〒580 大阪府豊中市岡上の町 2-6-7 (丹羽ビル) ☎(06) 849-7 4 6 6
九州営業所 〒804 北九州市戸畑区汐井町1-1(戸畑ステーションビル) ☎(093)884-0 3 0 9

カタログ贈呈